

AN2563

应用笔记

STM32F10xxx 调试应用示例

介绍

这篇应用笔记介绍STM32F10xxx固件库如何在调试模式下使用的应用程序示例。

这篇文档，它相关的固件库，和其他这样的应用笔记是为和STM32F10xxx 固件库配套而写的。这些都可从意法半导体的网站上下载: www.st.com.

1 如何在调试模式下使用STM32F10xxx使用固件库

1.1 概述

该部分介绍如何在调试模式下使用 STM32F10xxx 固件库

1.2 固件描述

给出的演示程序是在调试模式下使用 STM32F10xxx 固件库的

为了能够进入调试模式，必须在 `stm32f10x_conf.h` 文件中定义 `DEBUG`。它为 SRAM 的外设结构中创建了一个指针。于是调试变得很容易而且所有寄存器的设置都可以通过转储外设来获得。

当选择了调试模式，断言宏（`assert macro`）被扩大并且运行时间检测在固件库代码中被使能。运行时间检测用来检测所有的库函数的输入值是否在参数允许的范围内。

相关联的程序模拟一个传递给库函数的错误参数，错误源会在超级终端上显示出来。

注意： 调试模式增加了代码的大小而且减少了代码的性能，所以建议在调试应用程序的时候才使用它，在最后的应用程序代码中将其移出。

STM32F10xxx 固件库中提供了该固件的调试示例， 可以从意法半导体微控制器的网站上下载

2 修订记录

表1 修订记录

日期	修订	改变
2007-6-14	1	初次发布

版权声明：

MXCHIP Corporation 拥有对该中文版文档的所有权和使用权

意法半导体（ST）拥有对英文原版文档的所有权和使用权

本文档上的信息受版权保护。 除非经特别许可，否则未事先经过 MXCHIP Corporation 书面许可，不得以任何方式或形式来修改、分发或复制本文档的任何部分。